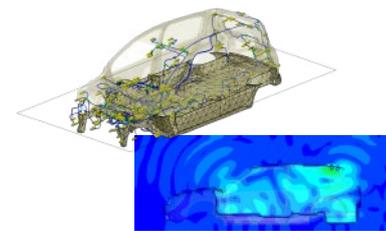


解析サービス

自動車ケーブルからのEMI解析



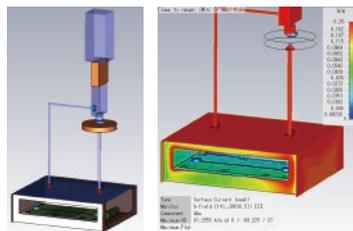
EMI, EMS解析



SI/PI レイアウト検証



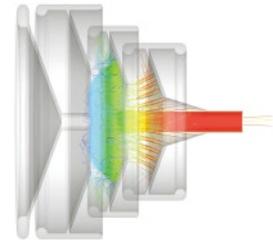
ESD解析



ウェアラブルアンテナ解析

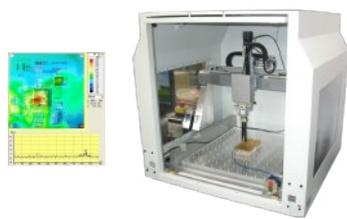


荷電粒子の解析



測定サービス

近傍界測定

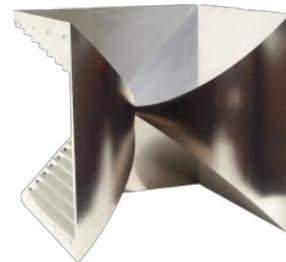


誘電率測定

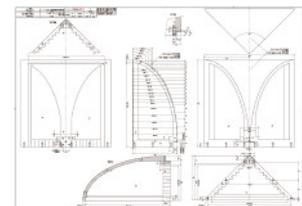
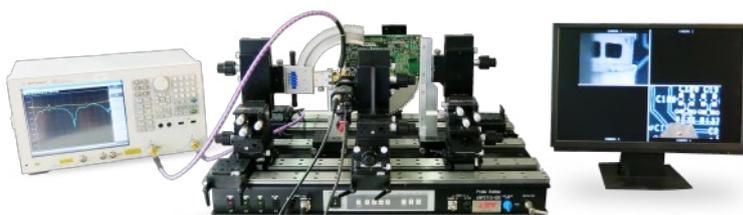


設計・試作サービス

ホーンアンテナの設計



両面プローブステーションによる高周波測定 (伝送線路特性評価)



設計・解析・測定サービス

Total Support for advanced information technology

解析サービス

電磁界解析

- 各種アンテナ
(平面・立体アンテナ、アンテナアレイ、UWB等)
- マイクロ波回路および素子
(平面・立体回路、フィルタ、導波管類、共振器等)
- 回路基板、コネクタの伝送特性
- ノイズ問題、静電気現象
- 静電磁界、低周波問題
- 光学素子・メタマテリアル

荷電粒子運動解析

- 電子銃
- イオン源
- 電子加速器
- イオン加速器 (RFQ/DTLなど)
- ビームライン
- 電子管 (クライストロン/マグネトロン/TWT)
- X線管

プラズマ解析

- プラズマ源
(大気圧プラズマ/容量性結合プラズマ/誘導性結合プラズマなど)
- 高密度プラズマフォーカス
- レーザー・プラズマ相互作用
- 放電現象

高度な開発・設計を支援するソフトウェアツール

- CST STUDIO SUITE (統合電磁界解析ソフトウェア)
- EGUN (電子銃設計と電界放出、電子軌道解析)
- IGUN (2次元プラズマイオン源解析)
- INTMAG (2次元静磁場解析)
- INP (3次元イオン源設計、イオン軌道解析)
- MAGIC (2次元/3次元電磁界・荷電粒子運動解析)
- EMSYS (2次元電磁界・荷電粒子運動解析)
- VSim (プラズマ解析)
- USim (流体プラズマ解析)
- LSP (大規模プラズマ解析)
- GPT (荷電粒子運動解析、加速器・ビームライン設計)
- PBO Lab (ビーム軌道解析、ビームライン設計)
- LIDOS (イオン加速器設計)
- Beamline Simulator (ビームライン設計)
- PrismSPECT (プラズマ分光解析)

設計・試作サービス

- アンテナ (UWB/Bluetooth/マイクロストリップ/アレイ/ホーン/移動体用)
- マイクロ波回路および素子 (キャビティ/導波管/カップラ/マイクロストリップ線路/誘電体共振器/フィルタ/トランジション/フェライトデバイス)
- コネクタ (同軸コネクタ、多極コネクタ)
- マイクロ波帯モジュール (低雑音増幅器、VCO、ミキサ、アッテネータ)
- 超高速PCB (評価用基板)

測定サービス

誘電率測定

- 回路基板、各種フィルム
- 樹脂、LCP、複合材
- ガラス、セラミックス
- 液体

高周波測定

- プリント基板 • フレキシブル基板 • 半導体パッケージ
- コネクタ • チップ部品 • コンタクトピン • 薄膜キャパシタ
- ベクトルネットワークアナライザによるSパラメータ測定 (~50GHz)
- コプレーナプローブによる測定、TEGの作成と測定
- スペクトラムアナライザによる測定 (~26.5GHz)
- Sパラメータからインダクタンス、キャパシタンスの算出
- TRL法、LRM法に基づくキャリブレーションキット、テストフィクスチャの作成

近傍磁界測定

- 高精度スキャナシステム (NECエンジニアリング製 4EM500) による近傍磁界測定 (~18GHz)

高速デジタルSI評価

- 差動伝送線路、Sパラメータ測定
- 波形応答測定 (~20GHz)、アイダイアグラム (~12.5Gbps)、ビットエラーレート(BER)測定、ジッタ測定
- シングルエンド、TDR測定、差動TDR測定、クロストーク測定
- 伝送線路テストクーポン作成

アンテナ測定

- 指向性ゲイン • 放射効率 ※ 協力会社にて実施

EMC、EMI測定、イミュニティ試験

- 3m遠方界測定 (~3GHz相対値、協力会社にて実施)
- 静電気放電(ESD)

主要設備・計測器

- アジレント E8364B~50GHz ネットワークアナライザ
- アジレント 86100A+54754A ~18GHz サンプリングオシロ、差動TDR
- アジレント N9020A~26.5GHz スペクトラムアナライザ
- アジレント DSO81304B 40G/S ~13GHz リアルタイムオシロスコープ
- アジレント N5382A~13GHz 13GHz広帯域差動アクティブプローブ
- アジレント N5230 300KHz~20GHz 4Port ベクトルネットワークアナライザ
- アジレント E4991A 1MHz~3GHz RFインピーダンス、マテリアルアナライザ
- アンリツ MP1761B~12.5GHz パルスパターンジェネレータ
- アンリツ MP1762A~12.5GHz エラーディテクタ
- アドバンテスト R6871E デジタルマルチメーター
- エーイーティー ~50GHz 誘電率測定装置
- キーエンス VHX-200~5000倍 マイクロスコープ (CCD)
- エスベック SH-240 小型環境試験器 (恒温槽)
- NECエンジニアリング 4EM500 CP-1S/CP-2S ~3GHz 近傍電磁界測定器
- エーイーティー AEMP002~18GHz 磁界プローブ
- エーイーティー ALMP001~3GHz 低周波・高電流・広帯域 磁界プローブ
- ノイズ研 ESS-2002 静電気試験器
- ノイズ研 TC-815R 放電ガン

©2013 AET, Inc. All rights reserved. C-SE102-003



株式会社 エーイーティー

<http://www.aetjapan.com>

本社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-7-6
TEL (044) 980-0505 (代表) FAX (044) 980-1515

研究開発センター

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-8-22
TEL (044) 981-0236 FAX (044) 981-0237